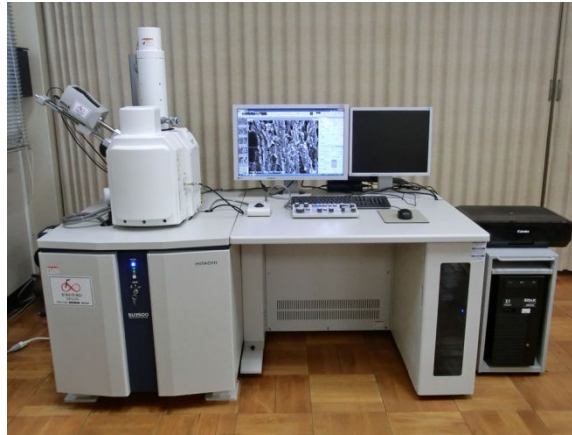


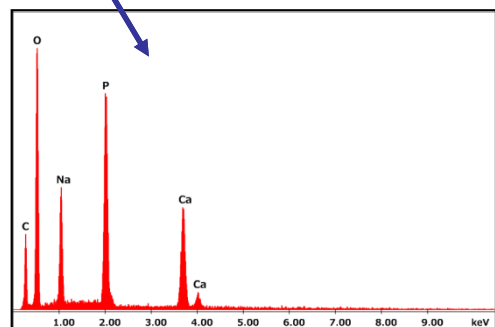
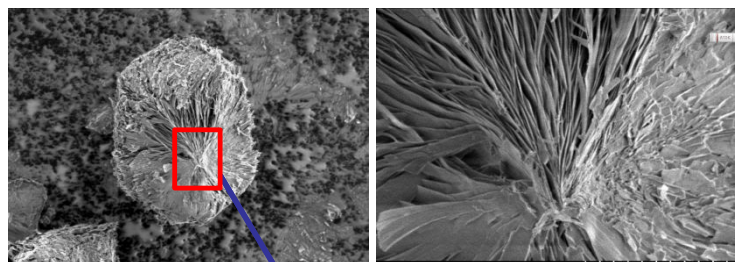
低加速走査型電子顕微鏡



機器名	低加速走査型電子顕微鏡(SEM用マイクロアナライザ付き)[SEM-EDS]
メーカー名	株式会社日立ハイテクノロジーズ
型式	SU3500
取得年月	2014/1 公益財団法人JKA競輪補助
用途	材料表面の微細構造観察および元素分析
仕様	倍率：10～30万倍(実用倍率：2万倍、試料により大きくかわります) 低真空モード10～650Pa設定可能、反射電子像、2次電子像 元素分析可Be～U 低加速電圧で従来より高解像度で観察できることが特徴です。

用途・使用例

微小サンプルの観察・元素分析、
低加速電圧での観察が可能
反射電子像、2次電子像の観察



注意点

油・水等の揮発物質は必ず除去して下さい。
必要に応じて導電性処理を行うことがあります。